



Научно стручно веће за техничко - технолошке науке

Предмет: Образац о испуњавању услова за избор у звање наставника

Име и презиме

Ivica Manić

Datum rođenja

3 / 10 / 1960.

Naziv i sedište ustanove/organizacije u kojoj je kandidat zaposlen

Elektronski fakultet u Nišu

Radno mesto

Vanredni profesor

Datum prvog izbora u sadašnje zvanje

14.7.2011.

Datum raspisivanja konkursa

17.12.2015.

Način (mesto) objavljivanja

Dnevni list "Narodne novine"

Zvanje za koje je raspisan konkurs

Vanredni profesor ili redovni profesor

Uža naučna oblast

Mikroelektronika i mikrosistemi

Odaberite oblast

Ostale oblasti

1. Naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira
(naziv doktorske disertacije, naučna oblast, godina i mesto odbrane)

"Efekti električnog naprežanja kod VDMOS tranzistora snage", naučna oblast: MOS tranzistori, 2006. Elektronski fakultet u Nišu

2. Sposobnost za nastavni rad

(naziv dokumenta, naziv ustanove/organizacije koja je izdala dokument, datum izdavanja)

Dokument usvaja Izorno veće Elektronskog fakulteta u Nišu

3. Ostvarene aktivnosti bar u četiri elementa doprinosa široj akademskoj zajednici iz člana 4. kriterijuma
(opis aktivnosti, podaci o dokumentima)

1. Učešće u radu tela fakulteta i univerziteta: Član Komisije za stručnu praksu 2004. godine, član Komisije za biblioteku 2008.

godine, član Komisije za obezbeđenje kvaliteta 2010. i 2012. godine, član Komisije za ocenu ispunjenosti kriterijuma za prijavu i ocenu i odbranu doktorskih disertacija i izbore u zvanja nastavnika 2010. i 2012. godine, član Disciplinske komisije 2010. i 2013. godine, član Saveta Elektronskog fakulteta 2013. godine.

2. Rukovođenje aktivnostima na fakultetu i univerzitetu: Koordinator svih Erasmus Mundus i Erasmus+ projekata Univerziteta u Nišu 2015. god.

3. Doprinos aktivnostima koje poboljšavaju ugled i status fakulteta i univerziteta: Član Uređivačko-savetodavnog odbora (Editorial Advisory Board) časopisa *Microelectronics Reliability* (Elsevier) od 2009. godine i član Programskog odbora međunarodnog naučnog skupa MIEL od 2010. godine; učešće u organizaciji sajma Bolonjski process i obrazovanje, nauka, inovacije, pronalazaštvo i zapošljavanje u Srbiji, održanog na Elektronskom fakultetu 2006. godine

4. Uspešno izvršavanje zaduženja vezanih za nastavu, mentorstvo, profesionalne aktivnosti ... : Uspešno držao nastavu iz 4 predmeta, mentor kandidata i predsednik komisija za odbranu 5 diplomskih radova, član komisija za odbranu 3 doktorske disertacije, 1 magistarske teze i 14 diplomskih i završnih radova

5. Recenziranje radova i ocenjivanje radova i projekata: Recenzirao radove za časopise *Microelectronics Reliability*, *IET Circuits, Devices and Systems* i *Facta Universitatis*, kao i za naučne skupove ETRAN, MIEL, ISPS, IPFA i studentsku konferenciju IEEEESTEC.

6. Organizacija i vođenje ... naučnih konferencija i skupova: Učešće u organizaciji međunarodnog naučnog skupa MIEL kao član Sekretarijata i Naučni sekretar od 1998. do 2008. godine

7. Učešće na ... konferencijama i skupovima: Učestvovao i sa uspehom prezentovao svoje naučne radove na većem broju konferencija: MIEL, ISPS, ESREF, MIXDES, CAS i ETRAN.

4. Ostvarene rezultati u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu

Rukovodio izradom 5 diplomskih radova i učestvovao u radu komisija za ocenu i odbranu 14 diplomskih i završnih radova, 1 magistarske teze i 3 doktorske disertacije. Učestvovao u radu 3 komisije za izbor u nastavnička zvanja (docent ili vanredni profesor) i nekoliko komisija za izbor asistenata na Elektronskom fakultetu. Saradivao sa mlađim kolegama (docenti, asistenti, studenti doktorskih studija) i pomagao im u radu na naučnim projektima i pisanju većeg broja naučnih radova za naučne časopise i konferencije, kao i u pisanju njihovih doktorskih disertacija.

5. Originalno stručno ostvarenje (projekat, studije), odnosno, rukovođenje ili učešće u naučnim projektima

Učešće u 6 nacionalnih projekata finansiranih od strane resornog ministarstva Republike Srbije, kao i 6 međunarodnih projekata realizovanih u saradnji Katedre za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta sa Institutom za fiziku čvrstog stanja Bugarske akademije nauka u Sofiji (4 projekta) i Institutom za mikroelektroniku Nacionalnog centra za naučna istraživanja "Demokritos" iz Atine (2 projekta)

6. Objavljeni udžbenik ili monografija

Snežana Golubović, Snežana Đorić-Veljković, Ivica Manić, Vojkan Davidović, "Efekti naprezanja oksida gejta VDMOS tranzistora snage", Edicija: Monografije, Elektronski fakultet Niš, 2006, ISBN 86-85195-16-0

7. Od izbora u prethodno zvanje najmanje jedan rad objavljen u časopisu koji izdaje Univerzitet u Nišu ili fakultet Univerziteta u Nišu ili sa SCI liste, u kojem je prvopotpisani autor rada

Ivica Manić, Danijel Danković, Vojkan Davidović, Aneta Prijić, Snežana Djorić-Veljković, Snežana Golubović, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, "Effects of pulsed negative bias temperature stressing in p-channel power VDMOSFETs", *Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics*, Vol. 29, no. 1, 2016, pp. 49-60, ISSN 0353-3670 (Print), ISSN 2217-5997 (Online), DOI:10.2298/FUEE1601049M, <http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/1288/782>

8. Od izbora u prethodno zvanje najmanje dva rada u časopisima kategorije M21 ili M22 ili M23 sa petogodišnjim impakt faktorom većim od 0.49 prema Tomson Rojters listi ili sa SCI liste, u kojima je prvopotpisani autor rada (podaci o naučnom radu, DOI broj)

1. Ivica Manić, Danijel Danković, Aneta Prijić, Vojkan Davidović, Snežana Djorić-Veljković, Snežana Golubović, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, "NBT related degradation and lifetime estimation in p-channel power VDMOSFETs under the static and pulsed NBT stress conditions", *Microelectron. Reliab.*, Vol. 51, 2011, pp. 1540-1543, ISSN 0026-2714, DOI:10.1016/j.microrel.2011.06.004 <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271411001946>

8 zamena: Rad u časopisu kategorije M21 zamenjuje se sa dva rada u časopisima sa SCIE liste u kojima je bar u jednom radu prvopotpisani autor rada (podaci o naučnim radovima, DOI broj)

1. Ivica Manić, Danijel Danković, Aneta Prijić, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, "Measurement of NBTI degradation in p-channel power VDMOSFETs", Informacije MIDEM J. Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 44, 2014, pp. 280-287, ISSN 0352-9045 (Print), ISSN 2232-6979 (Online), [http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_44\(2014\)4p280.pdf](http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_44(2014)4p280.pdf)

2. Danijel Danković, Ivica Manić, Aneta Prijić, Snežana Djorić-Veljčković, Vojkan Davidović, Ninoslav Stojadinović, Zoran Prijić, Snežana Golubović, "Negative bias temperature instability in p-channel power VDMOSFETs: recoverable versus permanent degradation", Semicond. Sci. Technol., Vol. 30, 2015, 105009 (9 pp.), ISSN 0268-1242 (Print), ISSN 1361-6641 (Online), DOI:10.1088/0268-1242/30/10/105009 <http://iopscience.iop.org/0268-1242/30/10/105009>

9. Veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima

1. Zoran Prijić, Danijel Danković, Aneta Prijić, Ivica Manić, Ninoslav Stojadinović, "A Method for Measuring NBTI Degradation in p-channel Power VDMOSFETs", Proc. 50th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (MIDEM 2014), Ljubljana (Slovenia), October 2014, pp. 9-16, ISBN 978-961-92933-4-8

2. Danijel Danković, Ninoslav Stojadinović, Zoran Prijić Ivica Manić, Aneta Prijić, "Recoverable and Permanent Components of VT Shift in Pulsed NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFETs", Proc. 29th Int. Conference on Microelectronics (MIEL 2014), Belgrade (Serbia), May 2014, pp. 297-300, ISBN 978-1-4799-5295-3

3. Snežana Djorić-Veljčković, Vojkan Davidović, Danijel Danković, Ivica Manić, Snežana Golubović, Ninoslav Stojadinović, "Recovery Treatment Effects on Gamma Radiation Response in Electrically Stressed Power VDMOS Transistors", Proc. 29th Int. Conference on Microelectronics (MIEL 2014), Belgrade (Serbia), May 2014, pp. 293-296, ISBN 978-1-4799-5295-3

4. Danijel Danković, Aneta Prijić, Ivica Manić, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović "Measurements of Negative Bias Temperature Instability (NBTI) in p-channel Power VDMOSFETs", Proc. 11th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2012), Prague (Czech Republic), August 2012, pp. 240-245, ISBN 978-80-01-04602-9

5. Ivica Manić, Danijel Danković, Aneta Prijić, Vojkan Davidović, Snežana Djorić-Veljčković, Snežana Golubović, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, "NBTI related degradation and lifetime estimation in p-channel power VDMOSFETs under the static and pulsed NBT stress conditions", Proc. 22nd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2011), Bordeaux (France), October 2011, pp. 1540-1543.

6. Ivica Manić, Danijel Danković, Snežana Djorić-Veljčković, Aneta Prijić, Vojkan Davidović, Snežana Golubović, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović "Negative Bias Temperature Instability in p-Channel Power VDMOSFETs Under Pulsed Bias Stress", Proc. 10th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2010), Prague (Czech Republic), September 2010, pp. 173-178, ISBN 978-80-01-04602-9

7. Ivica Manić, Elena Atanassova, Ninoslav Stojadinović, Dencho Spassov, "Effects of Constant Voltage Stress in Hf-doped Ta2O5 stacks", Proc. 27th Int. Conference on Microelectronics (MIEL2010), Niš(Serbia), May 2010, pp. 483-486, ISBN 978-1-4244-7198-0

8. Danijel Danković, Aneta Prijić, Ivica Manić, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, "Naponsko temperaturna naprezanja p-kanalnih VDMOS tranzistora snage", Zbornik radova 57. konferencije za ETRAN, Zlatibor, 3-6 Jun 2013, str. MO1.1-1-4, ISBN 978-86-80509-65-5.

9. Snežana Djorić-Veljčković, Ivica Manić, Vojkan Davidović, Danijel Danković, Snežana Golubović, Ninoslav Stojadinović, "Uticaj odžarivanja na oporavak električno napreznih p-kanalnih VDMOS tranzistora snage", Zbornik radova 57. konferencije za ETRAN, Zlatibor, 3-6 Jun 2013, str. MO1.2-1-6, ISBN 978-86-80509-65-5.

10. Ivica Manić, Danijel Danković, Ninoslav Stojadinović, "Modelovanje napona praga p-kanalnih VDMOS tranzistora snage tokom naponsko temperaturnih napreznja i odžarivanja", Zbornik radova 56. konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun 2012, str. MO1.2-1-4, ISBN 978-86-80509-65-5.

11. Danijel Danković, Aneta Prijić, Ivica Manić, Vojkan Davidović, Snežana Golubović, Zoran Prijić, Ninoslav Stojadinović, Snežana Djorić-Veljčković "Određivanje perioda pouzdanog rada p-kanalnih VDMOS tranzistora snage podvrgnutih kontinualnim i impulsnim NBT napreznjima", Zbornik radova 56. konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun 2012, str. MO1.1-1-4, ISBN 978-86-80509-65-5.

Potpis kandidata: _____

Manić

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
У НИШУ

Примљено	29.12.15.
Број	
	03/01-049/15-001

Napomena: Kandidat je dužan da popunjen, odštampan i potpisan obrazac o ispunjavanju uslova za izbor u zvanje nastavnika dostavi fakultetu koji je objavio konkurs zajedno sa ostalom dokumentacijom kojom dokazuje da ispunjava uslove